3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年７月６日から平成21年８月６日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成21年７月22日14時00分
⑵　開催場所　東北大学薬学部・薬学研究科薬学部棟１階中会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : The integrated high-precision mass spectrometer system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system must be the integrated high-precision mass spectrometry instruments which can separates of several organic compounds synthesized in laboratories and metabolites of bio-samples, and then can determine their exact-mass, and their structure determination by on-line.
B　The system must be the integrated high-precision mass spectrometry instruments which can do both qualitative analysis, quantitative analysis, and structure determination analysis for the very low-level peptides derived from bio-sample protein and unknown modified peptides by on-line using a high-energy collisional dissociation cell and the next generation ion trap technology.
C　The system must be the integrated high-precision mass spectrometry instruments which can do simultaneous quantitative analysis of small molecules, peptides, and biologics for bio-samples, which also has the high-field asymmetric waveform ion mobility separation interface.
D　The system must be the integrated high-precision mass spectrometry instruments which have an automatic gain control function in order to achieve optimum number of ions.
E　An ion transfer capillary tube must be exchangeable without breaking vacuum.
F　The system must include the technology of the Fourier transform mass spectrometry instruments.
G　The system must have the principle for the ideal electoric field.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 6, August, 2009
⑹　Contact point for the notice : Haga Masahumi, Procurement Section, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 21 年７月６日
国立大学法人東北大学理事　植木　俊哉
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04
○第 13 号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量
三次元微小構造解析システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
平成21年度第４四半期以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　フィールドエミッション走査透過電子顕微鏡装置
a　フィールドエミッション電子銃を有しており、低電流域ならびに大電流域でもプローブ径を小さくでき、かつ、高安定性を有すること。
b　一般の透過電子顕微鏡モードでの観察が可能であること。
c　微小領域における立体的な結晶・界面構造解析が可能であること。
d　広範囲な元素種に対して、サブナノ領域における高精度定量分析が可能であること。
e　観察像や電子線回折図形をデジタルファイルとして取り出せる高精度スロースキャンＣＣＤカメラを有すること。
f　設置環境の振動による分析精度への影響を少なくするため、除振機能を備えていること。
g　パーソナルコンピュータで扱えるデータフォーマット（標準テキスト形式など）を有していること。
B　集束イオンビーム加工観察装置
a　微小領域の高精度加工が可能であり、加工により得られた小片を同一チャンバー内でハンドリングが可能であること。
b　イオンビームによる試料のダメージを抑制する機能を有していること。
c　フィールドエミッション電子銃を有しており、低電流域ならびに大電流域でもプローブ径を小さくでき、かつ、高安定性を有すること。
d　ミクロンからナノオーダーでの結晶方位ならびに組成の３次元マップの取得が可能な後方散乱電子線回折自動解析装置と高精度組成分析機能を有すること。
e　設置環境の振動による加工・分析精度への影響を少なくするため、除振機能を備えていること。
f　パーソナルコンピュータで扱えるデータフォーマット（標準テキスト形式など）を有していること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成21年８月６日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒980―8577 仙台市青葉区片平２―１―１　東北大学財務部資産・調達管理課調達管理第二係長　芳賀　昌史　電話 022―217―4869
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年７月６日から平成21年８月６日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成21年７月13日10時00分
⑵　開催場所　東北大学工学部・工学研究科管理棟１Ｆホール
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : The three-dimensional materials structure analysis system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Field emission scanning transmission electron microscope apparatus
a　This apparatus should have a field emission electron gun, which can produce a stable electron beam with a very small diameter independent of beam current.
b　This apparatus should have the capability to observe the very small area through a normal transmission electron microscopic mode.
c　This apparatus should have the capability for precise 3-dimensional analyses of crystallographic and interfacial structure in a very small area.
d　This apparatus should offer high precision quantitative analyses for the wide range of elements in sub-nanometer scale.